

X射线荧光光谱仪/膜厚仪(专业型) 型号XRF-PT230-Y

手动变焦



- 应用领域: 电镀层厚度分析, 接插件等电子元器件检测, 紧固件行业, 汽车零部件, 五金行业(家用设备及配件等, 如Cr/Ni/CuZn(ABS)), 新能源行业(光伏焊带丝等), 配饰厚度分析, 伽玛射线上的Ni/Cu/Ni/FendB, 电镀液中的金属阳离子检测等
- 可检测90种涂镀层元素, 并用于合金中的77种元素成分分析
- 搭载微聚焦X射线发生器和先进的光路转换聚焦系统, 最小测量面积达0.03mm²
- 拥有无损手动变焦检测技术, 可对0-30mm各种异形凹槽件进行无损检测
- 装配Si-Pin半导体探测器, 分辨率高, 测试速度快, 数据稳定, 配有微光聚集技术, 最近测距光斑扩散度小于10%
- 核心EFP算法, 可同时分析23个镀层, 24种元素, 可对多层多元素, 包括同种元素在不同层都可快, 准, 稳的做出数据分析
- 人性化封闭软件, 自动判断故障, 提示校正及操作步骤, 避免误操作

技术参数

涂镀层分析	元素范围	锂Li (3)-铀U (92)
	检出限	0.005 μ m (不同元素检出限不同)
	分析厚度	0.01-80 μ m (不同元素检出限不同)
成份分析	元素范围	硫S (16)-铀U (92)
	检出限	2ppm (不同元素检出限不同)
	含量范围	0.1%-99%
EFP算法		标配
分析时间		5-300s
探测器		Si-Pin半导体探测器
X射线装置		微聚焦射线管
准直器		标配 \varnothing 0.3mm (可选 \varnothing 0.5mm, \varnothing 0.3mm, \varnothing 0.2mm, \varnothing 0.1 \times 0.3mm)
最近测距光斑扩散度		<10%
样品观测		1/2.7" 彩色CCD, 变焦功能
测量距离		变焦0-30mm
对焦方式		高敏感镜头, 手动对焦
样品腔高度		180mm
样品台移动方式		高精度XY手动滑轨
样品台移动范围		45mm \times 45mm
工作环境		15-30 $^{\circ}$ C, <70%RH
电源功率		AC220V, 50Hz, 95W
尺寸(长 \times 宽 \times 高)		545 \times 380 \times 435mm
重量		41kg

标准配置

主机	1个
电脑	1套
打印机	1个
附件箱	1个
12元素片	1套
镍纯元素标准片	1个
银纯元素标准片	1个

可选配置

电镀液测量杯	XRF-PT230-MC
溶液测试膜	XRF-PT230-SF
金纯元素标准片	MSS-P01
铬纯元素标准片	MSS-P02
铜纯元素标准片	MSS-P03
锌纯元素标准片	MSS-P04